

УДК 621.315.592

А. Г. Белоус, О. И. Вьюнов, В. В. Ковыляев

## ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК $\text{GeO}_2$ И $\text{Si}_3\text{N}_4$ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО $\text{BaTiO}_3$ \*

Исследованы физико-химические свойства полупроводникового  $\text{BaTiO}_3$  методами рентгено-фазового, термогравиметрического анализов и электронной микроскопии. Установлено, что при введении добавок  $\text{GeO}_2$  и  $\text{Si}_3\text{N}_4$  образуются соединения, влияющие на окислительно-восстановительные реакции, протекающие при синтезе керамики  $\text{BaTiO}_3$ . Показана зависимость электрофизических свойств от фазового состава полупроводниковой керамики.

Полупроводниковая сегнетокерамика  $\text{BaTiO}_3$  находит применение при изготовлении позисторов — термоочувствительных резисторов с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ПТКС) [1]. Выше температуры сегнетоэлектрического фазового перехода в позисторных материалах с ростом температуры наблюдается увеличение на несколько порядков сопротивления, которое характеризуется минимальным ( $\rho_{\min}$ ) и максимальным ( $\rho_{\max}$ ) значениями. Рост напряженности внешнего электрического поля приводит к снижению величины резистивной аномалии (варисторный эффект). Существенное влияние на основные характеристики позисторных материалов (кратность изменения сопротивления, минимальное удельное сопротивление и варисторный эффект) оказывают добавки германия и кремния [2—5].

Согласно [2], при введении в полупроводниковый  $\text{BaTiO}_3$  добавок германия и кремния уменьшается средний размер зерен керамики, с этим связывают уменьшение варисторного эффекта. При добавлении  $\text{GeO}_2$  (7 % (мол.)) снижается температура синтеза керамики с 1380 до 1300 °C [3]. Используя добавку  $\text{GeO}_2$ , можно получить полупроводниковую керамику, характеризующуюся при комнатной температуре низким значением сопротивления [4]. Добавление 0.5 % (вес.)  $\text{Si}_3\text{N}_4$  снижает на 100 °C температуру синтеза керамики  $\text{BaYTiO}_3$  [5]. Однако в литературе отсутствует объяснение получения низких значений сопротивления позисторной керамики при комнатной температуре при введении  $\text{GeO}_2$ , нет данных о влиянии добавки  $\text{Si}_3\text{N}_4$  на кратность изменения сопротивления.

Поэтому цель данной работы — выяснить характер воздействия добавок  $\text{GeO}_2$  и  $\text{Si}_3\text{N}_4$  на процесс синтеза и электрофизические свойства полупроводниковой керамики на основе титаната бария.

В качестве исходных реагентов для синтеза использовали соли и оксиды металлов марки “ос. ч”. Температура синтеза определялась количеством свободного оксида бария в получаемой шихте: после первой термообработки его концентрация не должна превышать 1 %. В полученную шихту вводили исследуемые добавки, концентрации которых составляли 0.1—10 % (мол.) и органическую связку, прессовали в диски диаметром 10 мм и толщиной 3 мм, после чего спекали при различных температурах (1250—1380 °C). Фазовые превращения изучали методом термогравиметрии на приборе типа

\* Работа финансирована Государственным комитетом Украины по вопросам науки и технологий в рамках программы фундаментальных исследований.

© А. Г. Белоус, О. И. Вьюнов, В. В. Ковыляев, 1996

Q-1000 ОД-102, скорость нагрева 10 град/мин. Полученные продукты идентифицировали рентгенографическим методом по дифрактограммам порошков, снятых на установке ДРОН-ЗМ ( $\text{CuK}\alpha$ -излучение). Электрофизические свойства измеряли в широком интервале температур и напряженностей электрического поля. В качестве электродов использовали химически нанесенный никель. Размеры кристаллитов керамики определяли с помощью рентгеновского микроанализатора JCXA "Supergroove 733" (JEOL, Япония), при этом образцы предварительно подвергали термохимическому травлению по методике, описанной в работе [6].

По данным дифференциального-термического анализа при нагревании системы  $(\text{BaLn})\text{TiO}_3-\text{GeO}_2$  (где Ln — редкоземельный элемент) наблюдается экзоэффект в районе 960 °C. На дифрактограммах образцов  $(\text{BaLn})\text{TiO}_3-\text{GeO}_2$ , прокаленных в интервале температур 900—1300 °C (табл. I), присутствуют отражения соединений  $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$  и  $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$ , образованных в результате взаимодействия  $(\text{BaLn})\text{TiO}_3$  с  $\text{GeO}_2$ . Согласно [7], температура 1312 °C соответствует эвтектическому плавлению системы  $\text{BaTiO}_3-\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ , фаза  $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$  плавится при 1200 °C [8]. Этим можно объяснить отсутствие пиков  $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$  и  $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$  на дифрактограммах образцов, прокаленных выше 1300 °C.

Т а б л и ц а 1

Фазовый состав прокаленных образцов систем  $\text{BaTiO}_3-\text{GeO}_2$  и  $\text{BaTiO}_3-\text{Si}_3\text{N}_4$

$T, ^\circ\text{C}$	$\text{BaTiO}_3-\text{GeO}_2$	$\text{BaTiO}_3-\text{Si}_3\text{N}_4$
800	$\text{BaTiO}_3$	$\text{BaTiO}_3$
900	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$ (следы)	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{TiO}_8$ (следы)
1000	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ (следы), $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ (следы), $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$
1100	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ , $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ , $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$
1200	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ (следы), $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$ (следы)	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ , $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$
1300	$\text{BaTiO}_3$	$\text{BaTiO}_3$ , $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ (следы), $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$ (следы)
1360	$\text{BaTiO}_3$	$\text{BaTiO}_3$

В соответствии с данными дифференциального-термического анализа, в системе  $(\text{BaLn})\text{TiO}_3-\text{Si}_3\text{N}_4$  экзоэффект наблюдается в районе 900 °C, при этом выше 800 °C начинает увеличиваться масса навески. Рост массы в системе  $(\text{BaLn})\text{TiO}_3-\text{Si}_3\text{N}_4$  при нагревании соответствует окислению нитрида кремния до  $\text{SiO}_2$ . При температурах 900—1300 °C титанат бария взаимодействует с оксидом кремния с образованием соединений  $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$  и  $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$  (см. табл. I). Согласно [9], фаза  $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$  плавится при 1300 °C, а для системы  $\text{BaTiO}_3-\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ , как указывалось выше, температура 1312 °C соответствует эвтектическому плавлению. Этим можно объяснить отсутствие пиков соединений  $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$  и  $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$  на дифрактограммах образцов, прокаленных выше 1300 °C.

Как показали исследования, введение  $\text{GeO}_2$  и  $\text{Si}_3\text{N}_4$  способствует образованию в титанате бария фазы  $\text{Ba}_6\text{Ti}_{17}\text{O}_{40}$ , которая легко восстанавливается при температурах выше 1300 °C и быстро окисляется при охлаждении на воздухе [7, 10, 11]. Присутствие легкоплавких соединений  $\text{Ba}_2\text{Ge}_2\text{TiO}_8$  и  $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$  в исследуемых системах  $(\text{BaLn})\text{TiO}_3-\text{GeO}_2$ ,  $(\text{BaLn})\text{TiO}_3-\text{Si}_3\text{N}_4$ , по-видимому, затрудняет окислительные процессы на стадии охлаждения, стабилизируя титан в трехвалентном состоянии. Поэтому степень восстановления керамики с добавками  $\text{GeO}_2$  и  $\text{Si}_3\text{N}_4$  повышается, на что указывают измерения удельного сопротивления керамики, которое понижается при введении в титанат бария  $\text{GeO}_2$  и  $\text{Si}_3\text{N}_4$ .

**Таблица 2**  
Результаты электрофизических исследований образцов BaTiO<sub>3</sub> с добавкой GeO<sub>2</sub> и Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>

Добавка	Концентрация добавки, % (мол.)	Кратность измерения сопротивления	Сопротивление при 20 °C, Ом·см	Величина варисторного эффекта, %	Средний размер зерен, мкм
—	—	1	10 <sup>6</sup>	5.0	10
GeO <sub>2</sub>	0.1	2	8·10 <sup>5</sup>	6.7	10
	0.5	3	10 <sup>5</sup>	7.6	15
	1.0	3·10 <sup>3</sup>	2·10 <sup>3</sup>	8.1	—
	3.0	2.4·10 <sup>4</sup>	2.5·10 <sup>2</sup>	8.6	—
	5.0	2.5·10 <sup>4</sup>	3·10 <sup>2</sup>	8.8	40
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	0.1	4	3·10 <sup>2</sup>	6.2	10
	0.5	3·10 <sup>3</sup>	5·10 <sup>2</sup>	7.0	16
	1.0	1.6·10 <sup>4</sup>	8·10 <sup>2</sup>	7.7	—
	3.0	2.5·10 <sup>4</sup>	3·10 <sup>2</sup>	8.0	—
	5.0	3·10 <sup>4</sup>	4·10 <sup>2</sup>	8.1	45

Результаты электрофизических исследований сведены в табл. 2. При увеличении содержания добавок GeO<sub>2</sub> или Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> до 1 % (мол.) кратность изменения сопротивления  $\rho_{\text{max}} / \rho_{\text{min}}$  возрастает на три порядка. Высокие значения кратности сохраняются до 5 % (мол.) как при введении добавки GeO<sub>2</sub>, что согласуется с результатами работы [5], так и при введении добавки Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Рост величины кратности изменения сопротивления обусловлен в основном снижением низкотемпературного сопротивления  $\rho_{\text{min}}$ .

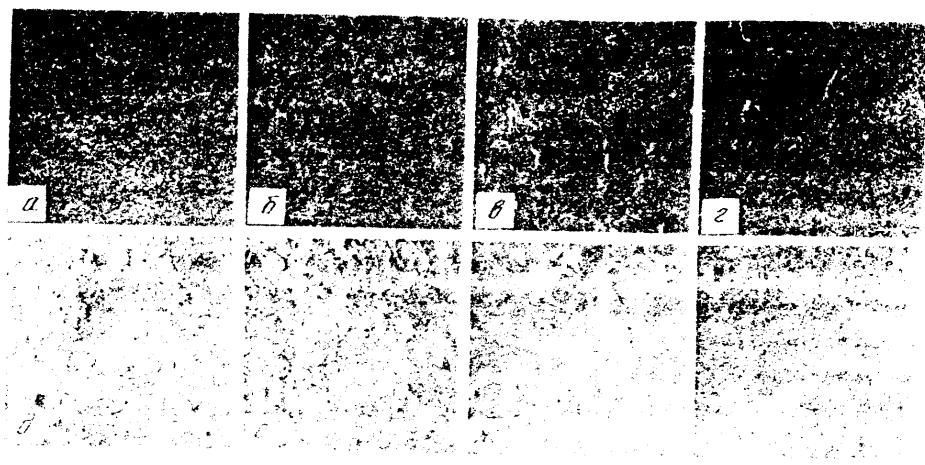
Варисторный эффект определяли в соответствии с уравнением [12]

$$K = -\frac{\ln(\rho_{E_1} / \rho_{E_2})}{E_1 - E_2} \cdot 100\%,$$

где  $\rho_{E_1}$  и  $\rho_{E_2}$  — удельное сопротивление при напряженностях электрического поля  $E_1$  и  $E_2$  (В/мм) соответственно.

При введении GeO<sub>2</sub> и Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> величина варисторного эффекта возрастает (табл. 2). Одним из факторов, влияющих на варисторный эффект, является размер зерен керамики. Последний определяли с помощью методов электронной микроскопии. Поверхность образцов позисторов предварительно подвергали термохимическому травлению, что заметно улучшало различимость границ зерен (см. рисунок). Зависимость величины варисторного эффекта от среднего размера зерен нелинейна. Отклонение от линейного закона можно объяснить изменением формы потенциального барьера на границах зерен (BaLn)TiO<sub>3</sub> [1] и влиянием сопротивления внутренних областей зерна [13].

Таким образом, при введении GeO<sub>2</sub> и Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в полупроводниковый титанат бария наблюдаются следующие закономерности. Введение добавки GeO<sub>2</sub> приводит к образованию наряду с фазой титаната бария соединений Ba<sub>6</sub>Ti<sub>7</sub>O<sub>40</sub> и Ba<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>TiO<sub>8</sub>. Присутствие фазы Ba<sub>6</sub>Ti<sub>7</sub>O<sub>40</sub> способствует восстановлению титана, а соединение Ba<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>TiO<sub>8</sub>, температура плавления которого 1200 °C, препятствует быстрому окислению керамики при охлаждении. Это приводит к снижению сопротивления полупроводникового титаната бария в низкотемпературной области. Введенный в титанат бария Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> при высокой температуре окисляется до SiO<sub>2</sub>, способствуя образованию слабовосстановительной среды. В результате взаимодействия между диоксидом кремния и титанатом бария образуются соединения Ba<sub>6</sub>Ti<sub>7</sub>O<sub>40</sub> и Ba<sub>2</sub>TiSi<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.



Фіг. 7. Кераміка барію титанату з додаванням GeO<sub>2</sub> та Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Видно, що зростання кристалічних фаз відбувається в низькотемпературній області.

Рис. 2. Ізотропні фізико-хімічні властивості напівпровідникової BaTiO<sub>3</sub> кераміки розглянуті використанням термо-термічного аналіза та електронної мікромісцескопії. Встановлено, що введені додаванки GeO<sub>2</sub> та Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> утворюють сполучки, які впливають на процеси відновлювальної реакції, що проходить при синтезі керамік. Це підвищує стабільність електро-фізичних властивостей від фазового складу напівпровідникової кераміки.

**SUMMARY.** Physico-chemical properties of semiconductive Ba-TiO<sub>3</sub> ceramics have been investigated using X-ray diffraction analysis, thermogravimetry, thermal analysis and electron microscopy. It has been found that dopants affecting redox reactions occurring during the synthesis of BaTiO<sub>3</sub> ceramics are formed when GeO<sub>2</sub> and Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> dopants are added. The dependence of electro-physical properties on phase composition of semiconductive ceramics has been shown.

1. Падуправдані на основі титанату барію / Пер. с японського И. Б. Рейта. -М. : Снепроект, 1982.
2. Лейкіна Е. І., Немухов А. І., Андреев Ю. В. // Ізв. АН ССР. Неорг. матеріали. -1986. -22, № 3. -С. 440—449.
3. Пат. 43—15261 Японія. МКІ 62 А 221. -Опубл. 27.06.1968.
4. Пат. 48—27556 Японія. МКІ H 04 С. С 04 В / М. Сюндо, В. Сигетака. -Опубл. 23.07.1973.
5. Пат. 2 097 773 А Великобританія. МКІ С 04 В 35/46 / Т. Хісса, Нl. Дой, О. Кампілло і др. -Опубл. 10.11.1982.
6. I. O. Owate, R. Freer // J. Am. Ceram. Soc. -1992. -75, № 5. -Р. 1266—1268.
7. O'Brayon H. M., Thomson I. // J. Amer. Ceram. Soc. -1974. -57, № 12. -Р. 520—522.
8. Masse, Durif // Bull. Soc. frans. min. Grist. -1967. -90. -Р. 407—408.
9. John T., Alfors, Melvin C. et al. // Amer. Min. -1965. -50. -Р. 314—340.
10. H. Inrig // Physica status solidi (a) -1978. -47, № 2. -Р. 437—444.
11. Великая Н. П., Квантов М. А., Рубальський Г. Д., Ярмаркін В. І. // Ізв. АН ССР. Неорг. матеріали. -1986. -22, № 3. -С. 518—519.
12. Пат. 47-41153 Японія. МКІ H 01 С. С 04 В / Ф. Нагао. -Опубл. 18.10.1972.
13. Al-Alak H. M., Shingsworth J., Brinkman A. W. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. -1989. -22, № 9. -Р. 1393—1397.